

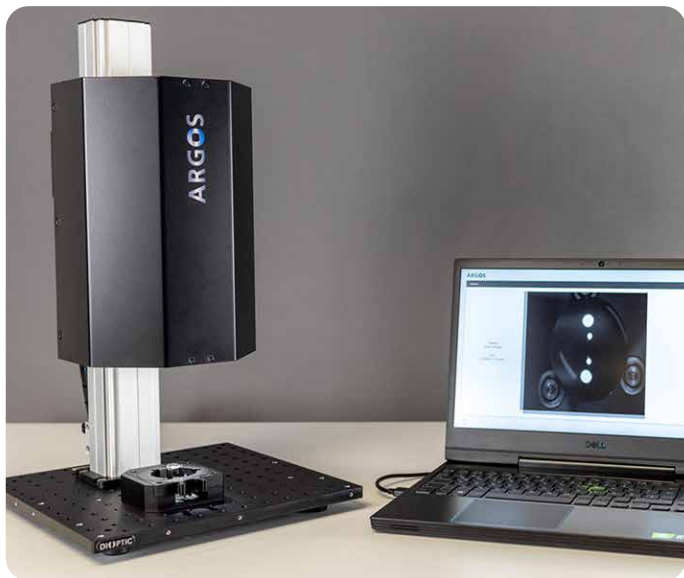
凸レンズの表面欠陥（キズ）を

DIOPHTIC

『目視検査』から『自動検査』へ

ISO 10110-7 準拠

【光学素子の外観検査装置】を紹介、販売しています。



ARGOS matrix 200



レンズの球面検査



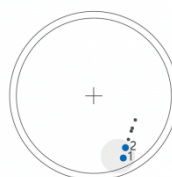
QBHコネクタ一端

ARGOS Test Report

Passed

Batch No, Sample No	Batch 5, Sample 16	Drawing number:	A001
Sample diameter (mm)	25	Clear aperture (mm)	23

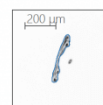
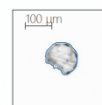
Surface 1 Overview



Circle, \varnothing 25.0 mm

Largest Defects

No.	Position from center	Type	Grade
1	4.37 mm, -9.23 mm	D	0.1600 mm
2	4.69 mm, -7.70 mm	D	0.1000 mm



Surface 1 Summary

	Specification	Detected	Result
5/ λ 0.16			
Largest dig grade	0.16 mm	0.16 mm	Passed
Effective area	0.0768 mm ²	0.0272 mm ²	Passed
Imperfection concentration	ISO 10110-7	1.0	Passed

検査報告書

測定の再現性あり

客観的な測定結果

自動化 → 効率化

ISO 10110-7に準拠

1.5 μ mの欠陥も検出

検査報告書 自動生成

BENEFITS メリット

1 フラットな光学素子から レンズの検査

EDOF (Extended Depth of Field) の技術を応用しています。
他社にない球面形状のレンズの欠陥検査まで対応しています。

2 ユーザー操作なし

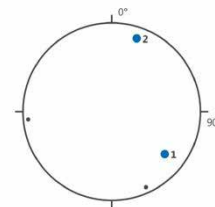
欠陥部品の早期発見による不具合品の流出防止。人件費や検査コストの削減。
人為的ミスから完全に独立し、生産能力の最大化に貢献します。

3 検査結果

均一で正確な検査を実現し、品質を担保することで信頼性を維持できます。
デジタル管理され、トレーサビリティや検査工程の安全性に寄与します。



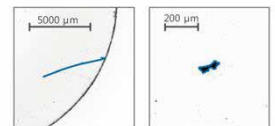
Overview



Largest Defects

No.	Position	Type*	Grade
1	R = 5.9 mm, $\varphi = 128.6^\circ$	L	0.010 mm
2	R = 6.8 mm, $\varphi = 18.9^\circ$	D	0.063 mm

*D = Dig, L = Scratch, E = Edge Chip



Summary

	Specification	Detected	Result
Imperfection concentration	ISO 10110-7	No	Passed
Largest dig grade	0.160 mm	0.063 mm	Passed
Effective area	0.051 mm ²	0.007 mm ²	Passed
Largest scratch width	0.010 mm	0.010 mm	Passed
Effective scratch width	0.010 mm	0.010 mm	Passed

SPECIFICATIONS 仕様

Parameter	ARGOS matrix 200
分解能	S : 1.5µm, M : 3µm, L : 4.5µm
検査範囲	205 x 205 mm
測定可能サイズ	< 1.5µm
ISO 10110-7 完全準拠	0.004 (digs), 0.0025 (scratches)
材質	ガラス, 金属, 半導体, プラスチック
装置サイズ	700 x 600 x 600 mm

記載内容および画像の転載、複製、加工などは禁止です。また、記載内容は予告なく変更することがあります。ご了承ください。 Ver.1.0_2404